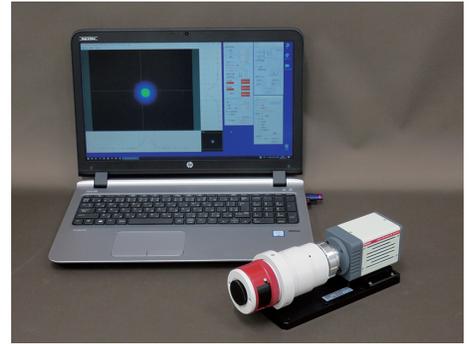


## コリメート光計測装置

専用光学系+画像処理・解析方式によるコリメート光のリアルタイム観察・計測用システム。コリメータレンズ調整等に最適。

コリメート光計測装置は、画像処理解析方式によりコリメート光のビーム拡がり角を高分解能かつリアルタイムで測定する装置です。コリメート光のビーム拡がり角をリアルタイムで観察・計測することができますので、コリメータモジュールのビーム品質評価やコリメータレンズの調整等に使用することができます。



### 【特長】

- コリメート光計測光学系 M-Scope type C を使用。
  - 専用光学系+画像処理解析方式。測定が迅速で調整も容易。
  - コリメートビームの拡がり角を高い計測角度分解能でリアルタイム観察・計測可能。
- 光検出器の選択で、400nm~1700nm 波長域のコリメート光測定に対応可能。
- 高性能光ビーム解析システム「光ビーム解析モジュール AP013」
  - データ解析装置・光ビーム解析ソフトウェア・検出器ドライバ・補正データ等オールインワンパッケージで、導入後直ちに使用可能。
  - 光ビームプロファイル計測用高性能画像処理ソフトウェア「光ビーム解析ソフトウェア Optimetrics BA Standard」をプリインストール。
- 各種自動精密位置決めステージや画像処理との連動により、コリメート光調整工程の省力化や自動化にも対応可能。

### 【システム主要構成】

- 光学系セレクション
  - コリメート光計測光学系 M-Scope type C
    - M-Scope type C/200 (焦点距離 200mm)
    - M-Scope type C/150 (焦点距離 150mm)
    - M-Scope type C/100 (焦点距離 100mm)
- 主な検出器セレクション
  - 400~1100nm：高精度 CMOS 検出器 ISA071・ISA071GL
  - 950~1700nm：InGaAs 高感度 SWIR 検出器 ISA041H2
  - 400~1700nm：InGaAs 高分解能 SWIR 検出器 ISA041HRA・ISA041HRA/GL
- 光ビーム解析モジュール AP013
  - データ処理装置本体、検出器ドライバ、光ビーム計測解析ソフトウェア Optimetrics BA Standard、補正用データ
- 付属品
  - 付属ケーブル類、マニュアル関連等

### 【オプション】

- 対物レンズセレクション
  - 対物レンズを装着すれば NFP 計測も可能です。対物レンズは、光学倍率(測定画角)・測定画素分解能・N.A.・分解能・波長等によりご選択ください。
- ND フィルタ
  - 可視用 (400-700nm) NDF-5 (5種類セット)
  - 近赤外用 (700-1100nm) NDF NIR-5 (5種類セット)
  - 赤外用 (1310-1550nm) NDF IR-5 (5種類セット)
- 光学系用架台
  - 手動ステージ付光ファイバ測定用光学系架台
  - 縦型光学系設置架台

### 【M-Scope type C の焦点距離・検出器セレクションと焦点距離・計測角度範囲・画素分解能】

検出器	高精度 CMOS 検出器 ISA071・ISA071GL		InGaAs 高感度 SWIR 検出器 ISA041H2		InGaAs 高分解能 SWIR 検出器 ISA041HRA	
計測波長域	400~1100nm		950~1700nm		400~1700nm	
画素数	2048×1536 画素		320×256 画素		1280×1024 画素	
ピクセルピッチ	3.45μm 角		20μm 角		5μm 角	
M-Scope type C の焦点距離	計測角度範囲	画素分解能	計測角度範囲	画素分解能	計測角度範囲	画素分解能
200mm	約 ±1.01°×±0.75°	約 0.001°	約 ±0.91°×±0.73°	約 0.0058°	約 ±0.91°×±0.73°	約 0.00145°
150mm	約 ±1.34°×±1.01°	約 0.0013°	約 ±1.22°×±0.97°	約 0.0077°	約 ±1.22°×±0.97°	約 0.00192°
100mm	約 ±2.02°×±1.51°	約 0.002°	約 ±1.83°×±1.46°	約 0.0115°	約 ±1.83°×±1.46°	約 0.00287°

\* 計測角度画素分解能：計測角度範囲と検出器のセンサピッチから計算される検出器 1 ピクセル相当の計測角度です。  
\* 上記以外の検出器も使用可能です。

### 【コリメート光計測装置 コンポーネントセレクション】

#### ○位置決めステージ・架台

サンプルステージ  
光学系ステージ

手動ステージ付ファイバ測定用光学系架台

Z軸粗調機構付縦型光学系架台

\* 各種電動・手動ステージとの組み合わせが可能

#### ○光学系セレクション

コリメート光計測光学系

- M-Scope type C/200
- M-Scope type C/150
- M-Scope type C/100

#### ○検出器セレクション

- 可視域 -1100nm 用  
高精度 CMOS 検出器 ISA071・ISA071GL
- 950-1700nm 用  
InGaAs 高感度 SWIR 検出器 ISA041H2
- 400-1700nm 用  
InGaAs 高分解能 SWIR 検出器 ISA041HRA・ISA041HRA/GL

#### ○光ビーム解析モジュール AP013

データ解析装置

- 本体
- I/F ボード関連
- 付属品

- 光ビーム計測解析ソフトウェア Optimetrics BA Standard
- 画像検出器ドライバソフトウェア
- 計測用補正データ

#### ○光学系アクセサリ

- 減光フィルタ (ND フィルタ)
- 対物レンズ